Search Notes					

10/751,418 Examiner

EDMUND H. LEE

Applicant(s)/Patent under Reexamination

TANAKA ET AL.

Art Unit

1732

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
UPDATED		12/15/2005	EHĹ		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
264	252,275	12/15/2005	EHL	
	267			
•	<u> </u>			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
UPDATED	12/15/2005	EHL	
	·		